

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-78317

(43) 公開日 平成10年(1998) 3月24日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 1 B 21/20			G 0 1 B 21/20	Z
G 0 6 F 9/06	5 3 0		G 0 6 F 9/06	5 3 0 A
// G 0 6 F 17/50			15/60	6 8 0 D

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願平8-234170

(22) 出願日 平成8年(1996) 9月4日

(71) 出願人 000004112

株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(72) 発明者 伊藤 泉

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン内

(72) 発明者 石川 文男

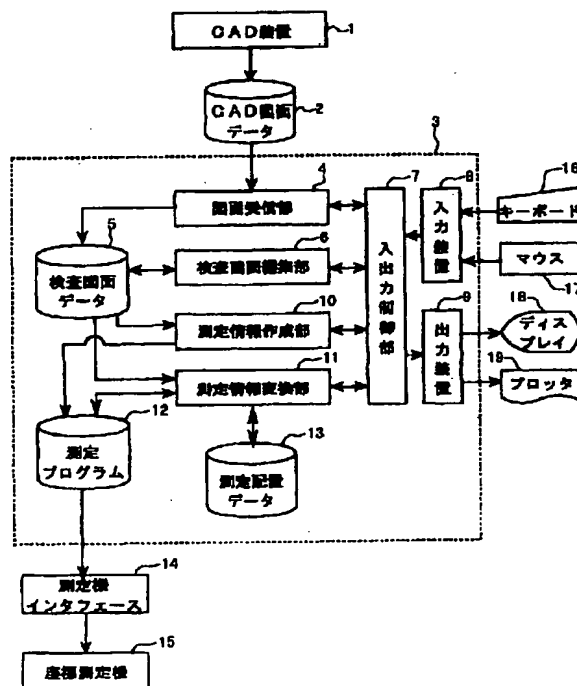
東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン内

(54) 【発明の名称】 測定プログラム作成装置

(57) 【要約】

【課題】 三次元測定機などで、部品の形状測定を短時間に効率よく行うために、測定機上に設置した複数の部品を一括して自動測定する測定プログラムを、短時間に効率よく作成する装置を提供する。

【解決手段】 複数の被測定物品の測定において、個々の被測定物品の測定プログラムおよび検査図面データを用いて、一括して測定する新たな測定プログラムを生成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の被測定物品の、それぞれの測定順および配置を表す、それぞれの測定配置データを生成する手段と、

前記複数の被測定物品のそれぞれの測定経路データを含む、それぞれの測定プログラムおよび、前記それぞれの測定配置データから、一括して測定する新たな測定プログラムを作成する手段を備えた、測定プログラム作成装置。

【請求項2】 複数の被測定物品の、それぞれの形状情報または寸法情報を含む、それぞれの設計図面データを読み込む手段と、

前記それぞれの設計図面データに三次元情報を付加した、それぞれの検査図面データを作成する手段と、

前記それぞれの検査図面データを用いて、前記複数の被測定物品の測定経路データを含む、それぞれの測定プログラムを作成する手段と、

前記それぞれの測定プログラムおよび、前記それぞれの検査図面データとを用いて、前記複数の被測定物品の測定順および配置を表す、それぞれの測定配置データを生成する手段と、

前記それぞれの測定プログラムおよび、前記それぞれの測定配置データから、一括して測定する新たな測定プログラムを作成する手段と、を備えた測定プログラム作成装置。

【請求項3】 請求項2において、前記それぞれの測定プログラムを組み合わせ、新たな測定プログラムを作成することを特徴とする、測定プログラム作成装置。

【請求項4】 請求項2において、前記新たな測定プログラムの作成は、測定機とオフラインの状態で行うことを特徴とする、測定プログラム作成装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、被測定物品の形状を測定するための測定プログラムを作成する測定プログラム作成装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来より、機械部品等の測定においては下記のような作業が行なわれている。

1. 測定機上に被測定物品を設置する。
2. 作業者が測定機を操作して測定手順を教示し、測定プログラムを作成する。
3. 作成された測定プログラムに従って実測定を行う。

【0003】 また、最近では2の変形として、被測定物品のCAD図面データを利用して画面上で測定教示のシミュレーションを行い、測定プログラムを作成するといったオフラインティーチング装置も実現されている。また、検査現場においては、多数の被測定物品を短時間に検査するために、測定機上に複数の被測定物品を設置し、一括して自動測定するといったことがなされてい

る。例を2つ以下にあげる。

例1（異型被測定物品の場合）：作業者が実際に測定を行いながら、すべての被測定物品の測定経路を手作業で教示して測定プログラムを作成し、それを測定機に渡し実行する。

例2（同型被測定物品の場合）：測定機上に一定間隔で並べ、測定実行時に作業者が被測定物品の設置数と設置間隔を入力することによって、手作業あるいはオフラインティーチングによって作成した被測定物品単体に対する測定プログラムを、設置した被測定物品の個数だけ繰り返し実行させるなどの方法が行われている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 近年、機械部品等の製作技術の進歩及び製品に対する消費者の要求により、複雑な形状の被測定物品、製品が増加する傾向にあり、製品の製造工程において、型検査等に要する時間の増加が懸念されている。また、検査現場においては、三次元測定機や工場顕微鏡等の座標測定機が普及しつつある。

【0005】 このような背景のもとで、被測定物品の検査作業を短時間に効率よく行うために、測定機上に設置した複数の被測定物品を一括して自動測定する測定プログラムを、短時間に効率よく作成する装置が求められていた。しかし、従来の測定プログラムの作成装置では、このような測定プログラムを作成する場合、測定機上に測定時と同じ配置に被測定物品を設置し、作業者が実際に測定機を操作しながら測定教示を行うという方法しかない。そのため、測定準備や測定プログラムの作成に時間がかかり、また、一旦作成した測定プログラムに対しては、被測定物品の種類や配置、測定順等を柔軟に変更できないという問題点や、あるいは、測定プログラムの作成時に測定機を占有してしまう等の問題点があった。

【0006】 また、従来のCAD図面データを利用したオフラインティーチング装置では、単体の被測定物品に対する測定プログラムの作成しかできない。したがって、この装置によって作成した測定プログラムを用いて、複数の被測定物品を一括して測定する手段としては、同一形状の被測定物品を測定機上に一定間隔で配置し、測定時に被測定物品数と設置間隔を作業者が入力することにより、測定プログラムを繰り返し実行させる等の方法が取られていた。しかし、この測定方法では、一括して測定する被測定物品の形状や配置が制限されてしまうため、異なる形状の被測定物品を一度に測定することができないという問題点があった。

【0007】 本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたものであり、検査業務の効率化を実現することができる測定プログラム作成装置を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】 上記従来の課題を解決するために、本発明の測定プログラムの作成装置におい

て、請求項1の発明では、複数の被測定物品の、それぞれの測定順および配置を表す、それぞれの測定配置データを生成する手段と、前記複数の被測定物品のそれぞれの測定経路データを含む、それぞれの測定プログラムおよび、前記それぞれの測定配置データから、一括して測定する新たな測定プログラムを生成する手段を備えた構成とした。

【0009】請求項2の発明では、複数の被測定物品の、それぞれの形状情報または寸法情報を含む、それぞれの設計図面データを読み込む手段と、前記それぞれの設計図面データに三次元情報を付加した、それぞれの検査図面データを作成する手段と、前記それぞれの検査図面データを用いて、前記複数の被測定物品の測定経路データを含む、それぞれの測定プログラムを作成する手段と、前記それぞれの測定プログラムおよび、前記それぞれの検査図面データとを用いて、前記複数の被測定物品の測定順および配置を表す、それぞれの測定配置データを生成する手段と、前記それぞれの測定プログラムおよび、前記それぞれの測定配置データから、一括して測定する新たな測定プログラムを生成する手段と、を備えた構成とした。

【0010】請求項3の発明では、請求項2において前記それぞれの測定プログラムを組み合わせ、新たな測定プログラムを作成することを特徴とする構成とした。請求項4の発明では、請求項2において前記新たな測定プログラムの作成は、測定機とオフラインの状態で行うことを特徴とする構成とした。

【0011】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明の説明を行なう。図1は、本発明の一実施例の構成を示すブロック図であり、以下の説明において随時参照する。本発明の測定プログラム作成装置3は、図面受信部4、検査図面編集部6、入出力制御部7、入力装置8、出力装置9、測定情報作成部10、測定情報変換部11とを備えている。

【0012】図面受信部4は、被測定物品の設計を行うCAD装置1から、このCAD装置1で作成された、被測定物品の形状を含むCAD図面データ2を受信する。CAD図面データ2は、通常CADの標準フォーマット(IGES)の形式で作成、保存されている。また、図面受信部4は、受信したCAD図面データ2を検査図面データ5に変換する。検査図面データ5は、例えば、図2に示すように、被測定物品またはこの被測定物品において測定対象となる部分(平面、穴、突起部など)について、その形状を示す形状情報21、二次元で表示された図面を三次元の中で位置付けする立体化情報22等から構成される。立体化情報22は、例えば、XYZの三次元座標系を想定し、平面図をXY平面上に、側面図をYZ平面上に設定して各図面に対して前記座標系を表示することで、その図面を三次元空間の中で位置付けする

ものである。

【0013】検査図面編集部6は、測定準備の前処理として、一旦変換された検査図面データ5に図面修正、立体化情報22等の付与を行い、改めて検査用の検査図面データ5に編集する。入出力制御部7は、作業者が操作するキーボード16、マウス17等の入力機器が設けられた入力装置8と接続されており、入力装置8に入力された作業からの指示を、図面受信部4、検査図面編集部6、測定情報作成部10、および測定情報変換部11に出力することができる。作業者は、出力装置9の表示画面を確認しながら必要な指示を与える。また、入出力制御部7は、検査図面データ5の所望の情報(例えば、図面)を図面受信部4、検査図面編集部6、または測定情報作成部10、または測定情報変換部11のいずれかを經由して、ディスプレイ18、プロッタ19等が設けられた出力装置9に表示する。

【0014】測定情報作成部10は、変換された検査図面データ5をもとに、測定対象の形状測定に関する手順の教示を作業者から受け、その教示内容をもとに測定の手順を示す測定経路データを含む測定プログラム12を作成する。測定手順の教示内容は、作業者が入力装置8、入出力制御部7を介して伝達する。測定プログラム12は、例えば、図3に示すように、測定の対象となる項目(平面、直線、円など)を示す測定項目32、測定の順番を示す測定項目番号31、測定時に測定子が動く測定パス(測定経路)33等から構成される。ここで、測定パス33は、検査図面データに対して設定する三次元座標系(基準座標系)における点列として定義されており、測定時に測定機の機械座標系の点列に変換される。

【0015】測定情報変換部11は、作成された測定プログラム12および検査図面データ5を読み込み、測定時における測定対象(被測定物品)の測定機上の配置や測定の順番等の情報を含む測定配置データ13を生成する。測定配置データ13は、例えば、図4に示すように、測定する被測定物品の測定順を示す測定順番号41、測定プログラム名42、および、それぞれの検査図面が独立に持つ基準座標系の座標値として生成された測定パスの座標値を、ある定まった基準座標系の座標値に変換する変換マトリクス43等から構成される。また、測定情報変換部11では、測定配置データ13から、読み込んだすべての測定プログラム12の測定手順および測定パスを変換し、新たな測定プログラム12を生成する。

【0016】生成された測定プログラム12は、測定機インタフェース14において、座標測定機15に渡される。座標測定機15は、この測定プログラム12を受けて、被測定物品の測定を行う。以上の構成の本発明における動作を以下に説明する。CAD装置1から入力されたCAD図面データ2は、図面受信部4において、変換

され、検査図面データ5が作成される。作成された検査図面データ5をもとに、測定情報作成部10では、測定プログラム12が作成される。作成された測定プログラム12は、測定情報変換部11に読み込まれ、被測定物品の配置や測定の順番等の設定を行い、新たな測定プログラム12が作成される。さらに、測定機インタフェース14において、測定プログラム12が座標測定機15に渡され、実際の測定が行われる。

【0017】測定情報作成部10における、測定プログラム12を作成する手順の一例を図5を用いて説明する。ステップs1において、検査図面データ5を表示した図面上で、測定パスの基準となる座標系を作業者が任意に設定する。次に、ステップs2では測定対象となる形状要素を、作業者がマウスを用いて図面上で指示する。次のステップs3では、測定点数、測定方向等の、測定に必要な測定条件を作業者が設定する。測定情報作成部10はステップs4で、前記測定条件により測定パスを生成し、ステップs5で、生成された測定パスを測定プログラム12に登録する。この図5における指示方法は、すべて対話形式で行なう。ステップs1からs5の処理を繰り返すことにより、単体の被測定物品の測定データの履歴情報が測定プログラム12上に生成される。すなわち、測定を指示した順に、その一連の操作履歴を時系列的に作成することで、測定経路データが生成される。生成された測定プログラム12は記憶媒体に保存される。この測定プログラム12は、検査図面や被測定物品の種類ごとに作成し、また、ある被測定物品に対して、測定手順の異なる測定プログラム12を複数作成する。

【0018】次に、測定情報変換部11において、複数の測定プログラム12を利用して、新しい測定プログラム12を作成する手順の一例を図1、図6、図7を用いて説明する。測定情報変換部11において、図6ステップr1では、記憶媒体に格納された測定プログラム12の中から、任意の測定プログラム12を、作業者が測定情報変換部11に読み込む。読み込んだ測定プログラム12は、図7の測定順表示部71に、測定プログラム名および、被測定物品の測定順を示す測定順番号が、出力装置9を通して表示される。また、このとき、測定プログラム12に対応する検査図面データ5も同時に読み込まれ、被測定物品配置表示部72に表示される。被測定物品配置表示部72は、三次元座標系の一座標平面、すなわち、XY、YZ、ZX面のうちのいずれかを表示するようになっており、作業者の指示によって切り替える。また、被測定物品配置表示部72は、すべての被測定物品配置の基準となる基準座標系73を有している。

【0019】測定プログラム12が測定情報変換部11に読み込まれ、測定順表示部71に、測定順番号、測定プログラム名が、被測定物品配置表示部72に、検査図面データ5が表示されると、測定情報変換部11は、被

測定物品配置表示部72の基準座標系73に対する検査図面データ5の位置から、検査図面データ5の基準座標系の座標値を被測定物品配置表示部72の基準座標系73の座標値に変換する変換マトリクス43(図4)を生成し、測定順番号41および測定プログラム名42とともに測定配置データ13に格納する。

【0020】こうして、測定するそれぞれ単体の被測定物品に対応した、すべての測定プログラム12を読み込む。図7測定順表示部71に表示された図4測定順番号41は、実際に測定を行う際の被測定物品の測定順を表す。また、被測定物品配置表示部72に表示する図面データは、読み込んだときに相互に重ならないよう、自動的に位置をずらして表示することもできる。また、測定順表示部71の測定プログラム名あるいは部品配置表示部72の検査図面データ5を、作業者がマウス17によって選択し、測定情報作成部10を呼び出すことにより、選択した測定プログラム12の測定経路データを任意に編集することもできる。

【0021】次に、図6ステップr2では、測定情報変換部11が読み込んだそれぞれの検査図面データ5に対し、測定時の測定機上の被測定物品設置領域における被測定物品の配置を設定する。被測定物品配置の設定は、被測定物品配置表示部72に表示された検査図面データ5の表示位置を変更することによって行う。まず、被測定物品配置表示部72に表示された検査図面データ5を作業者がマウス17で指示する。次に、選択した検査図面データ5を作業者の望む位置に移動、あるいは回転させる。この操作は、移動量および回転量をキーボード16で入力することによって行っても良い。また、移動量、回転量のかわりに、被測定物品配置表示部42の基準座標系43に対する、それぞれの測定プログラム12の基準座標系の距離や座標軸の回転角を入力することによって設定しても良い。検査データの表示位置を変更すると、それに従い、該当する被測定物品配置データ13の変換マトリクスが自動的に変更される。この操作をすべての検査図面データ5に対して行うことにより、全体の被測定物品配置を決定し、測定配置データ13の変換マトリクスを変更する。

【0022】次に、ステップr3では、被測定物品どうしの測定順を設定する。測定順の設定は、測定順表示部41に表示された測定プログラム名の序列を作業者が入れ換えることによって行う。すなわち、表示されている測定プログラム名の中から任意のプログラム名を作業者がマウス17等の手段によって選択し、上下に移動することによって、表示の序列を変更し、その結果に従って、測定配置データ13の測定順番号が自動的に変更される。

【0023】ただし、被測定物品配置の設定(ステップr2)および測定順の設定(ステップr3)は、測定プログラム12の変換を終了するまでの間、任意に行うこ

とができる。最後に、ステップr4では、こうして作成した測定配置データをもとに、新しい測定プログラム12を生成する。このとき、新たに生成される測定プログラム12の測定経路データは、測定配置データ13の測定順に従って、読み込まれた測定プログラム12の持つすべての測定経路データから設定され、また、読み込んだすべての測定プログラム12の測定パスは、測定配置データ13の変換マトリクス43によって、被測定物品配置表示部72の持つ基準座標系73の座標値に変換され、測定プログラム12に格納される。また、このようにして作成された測定プログラム12は、新たな測定プログラム12を作成する際に、再び測定情報変換部11に読み込み、利用することも可能である。

【0024】この実施例の測定プログラム作成装置3によれば、複数の部品を一括して測定する測定プログラムの作成が、座標測定機15とはオフラインで行えるため、測定プログラム作成時に座標測定機15を使用する必要がなく、座標測定機15の稼働率を向上させることができる。また、一旦作成した測定プログラムを自由に組み合わせることができ、一括して測定する被測定物品の配置や測定する順番等も簡単な操作で設定、変更できるため、被測定物品の種類や配置を制限されることがなくなり、測定機上の被測定物品設置領域を有効に利用するような配置を設定することが可能となり、極めて効果的な測定を実現することができる。

【0025】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、一度に測定する被測定物品数を多くすることができることから、測定作業の効率を向上させることができる。また、この測定プログラムの作成作業は、オフラインで行えるため、測定機上で作業を行なう必要がなく、測定機の稼働率を向上させることができる。

【0026】さらに、測定する物品の組み合わせの変更や、物品個々の測定する順番の変更等の要求があった場合にも、測定プログラムを修正することが可能なため、測定プログラムの作成、修正に要する時間の短縮や、測定機の稼働率の向上を実現することができる。また、測定機の部品設置領域を有効に利用するような物品配置を設定することが可能となり、一度に測定する物品数を多くすることができる等、効果的な測定支援を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】は、本発明の実施例による測定プログラム作成装置の構成を示す概略ブロック図である。

【図2】は、同装置における検査図面データ内の検査図面の表示例である。

【図3】は、同装置における測定プログラムのデータ構造を示す模式図である。

【図4】は、同装置における測定配置データのデータ構造を示す模式図である。

【図5】は、同装置における測定プログラム作成の要部を示す流れ図である。

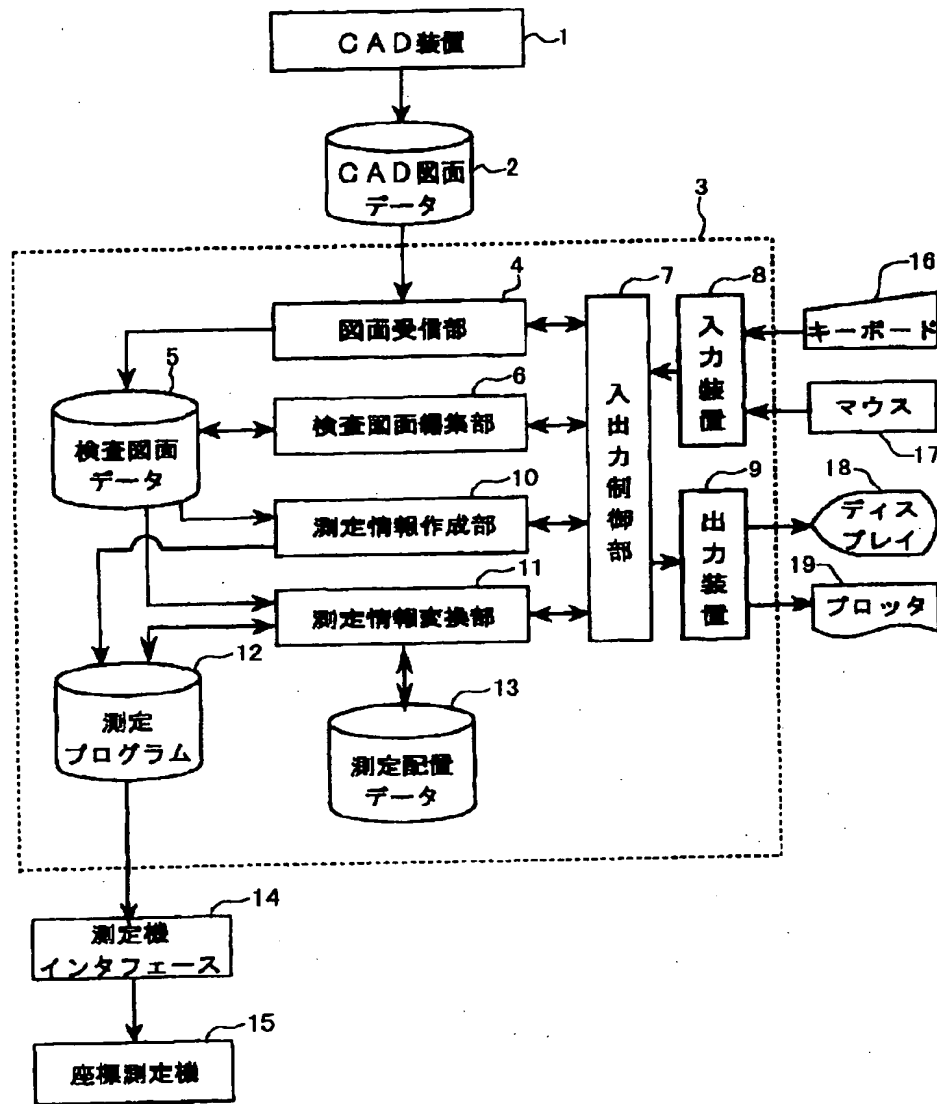
10 【図6】は、同装置における測定プログラム変換の要部を示す流れ図である。

【図7】は、同装置における物品配置および測定順の表示例である。

【符号の説明】

- 1 CAD装置
- 2 CAD図面データ
- 3 測定プログラム作成装置
- 4 図面受信部
- 5 検査図面データ
- 6 検査図面編集部
- 7 入出力制御部
- 8 入力装置
- 9 出力装置
- 10 測定情報作成部
- 11 測定情報変換部
- 12 測定プログラム
- 13 測定配置データ
- 14 測定機インタフェース
- 15 座標測定機
- 16 キーボード
- 30 17 マウス
- 18 ディスプレイ
- 19 プロッタ
- 21 形状情報
- 22 立体化情報
- 31 測定項目番号
- 32 測定項目
- 33 測定パス
- 41 測定順番号
- 42 測定プログラム名
- 40 43 変換マトリクス
- 71 測定順表示部
- 72 物品配置表示部
- 73 物品配置の基準座標系

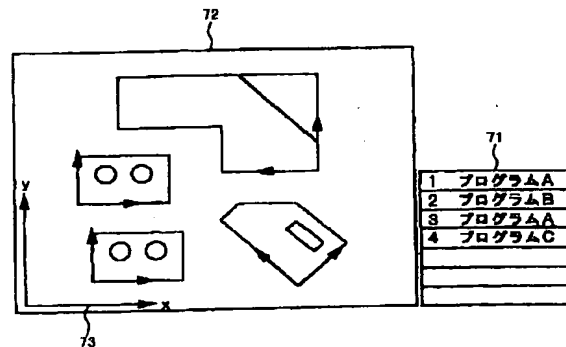
【図1】



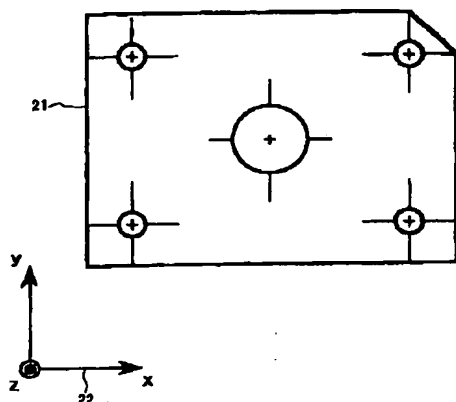
【図3】

測定項目番号	測定項目	測定パス
1	平面	p1,p2,p3
2	直線	p1,p2
3	円	p1,p2,p3

【図7】



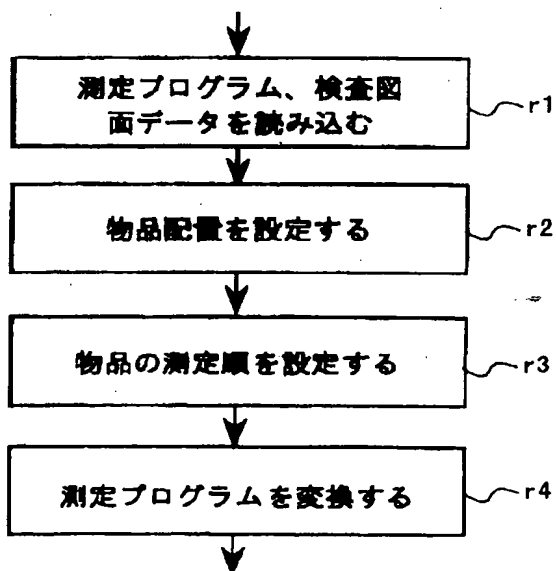
【図2】



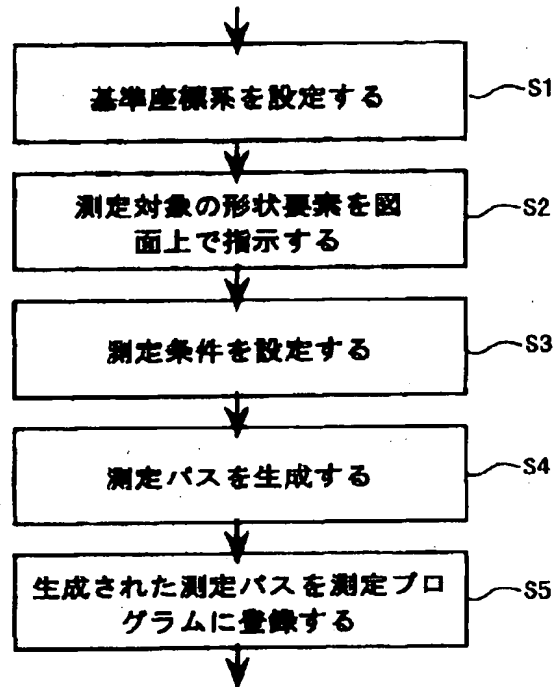
【図4】

測定順番号	測定プログラム名	変換マトリクス
1	プログラムA	$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$
2	プログラムB	$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$
3	プログラムA	$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$
4	プログラムC	$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$

【図6】



【図5】



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-078317
(43)Date of publication of application : 24.03.1998

(51)Int.Cl.

G01B 21/20
G06F 9/06
// G06F 17/50

(21)Application number : 08-234170
(22)Date of filing : 04.09.1996

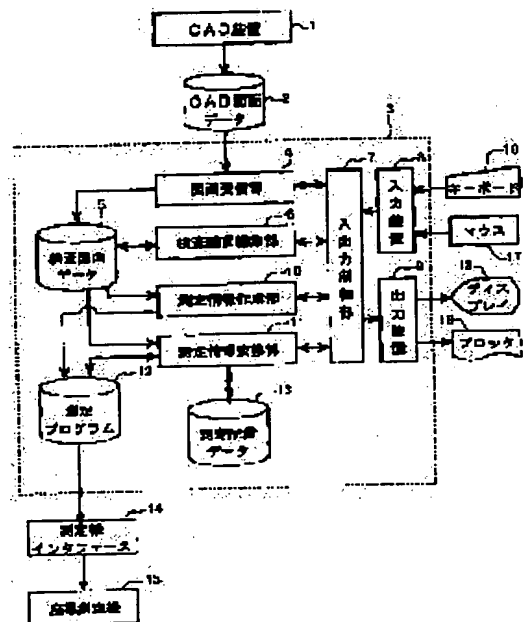
(71)Applicant : NIKON CORP
(72)Inventor : ITO IZUMI
ISHIKAWA FUMIO

(54) MEASUREMENT PROGRAM PREPARATION DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make an inspection work efficient by installing a means for preparing inspection drawing data with three-dimensional information added to the design drawing data of a measurement object, a means for preparing a measurement program by use of the inspection drawing data, or the like.

SOLUTION: A drawing receiving part 4 receives CAD drawing data 2 including the shape of a measurement object from a CAD device 1 used to design the measurement object, and adds three-dimensional information thereto for the conversion of the data 2 into inspection drawing data 5. An inspection drawing editing part 6 (i.e., data preparation means) applies a drawing correction, three-dimensional information or the like to the inspection drawing data 5 for the re-edition thereof. Also, an input/output control part sends an instruction inputted to an input device 8 from a worker, to the inspection drawing editing part 6, a measurement information preparation part 10 and a measurement information conversion part 11. The measurement information preparation part 10 (i.e., program preparation means) receives an instruction regarding procedures related to the shape measurement of the measurement object from the worker and, then, prepares a measurement program 12 including measurement rout data to show measurement procedures.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision]

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-078317

(43)Date of publication of application : 24.03.1998

i1)Int.Cl.

G01B 21/20
G06F 9/06
// G06F 17/50

1)Application number : 08-234170

(71)Applicant : NIKON CORP

2) Date of filing : 04.09.1996

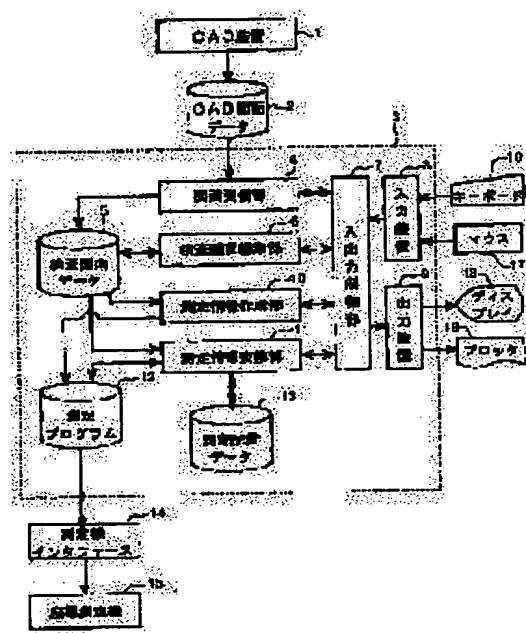
(72)Inventor : ITO IZUMI
ISHIKAWA FUMIO.

4) MEASUREMENT PROGRAM PREPARATION DEVICE

i7)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make an inspection work efficient by installing a means for preparing inspection drawing data with three-dimensional information added to the design drawing data of a measurement object, a means for preparing a measurement program by use of the inspection drawing data, or the like.

SOLUTION: A drawing receiving part 4 receives CAD drawing data 2 including the shape of a measurement object from a CAD device 1 used to design the measurement object, and adds three-dimensional information thereto for the conversion of the data 2 into inspection drawing data 5. An inspection drawing editing part 6 (i.e., data preparation means) applies a drawing correction, three-dimensional information or the like to the inspection drawing data 5 for the re-edition thereof. Also, an input/output control part sends an instruction inputted to an input device from a worker, to the inspection drawing editing part 6, a measurement information preparation part 10 and a measurement information conversion part 11. The measurement information preparation part 10 (i.e., program preparation means) receives an instruction regarding procedures related to the shape measurement of the measurement object from the worker and, then, prepares a measurement program 12 including measurement route data to show measurement procedures.



LEGAL STATUS

Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

Date of final disposal for application]

Patent number]

Date of registration]

Number of appeal against examiner's decision of election]

Date of requesting appeal against examiner's decision

NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any
 damages caused by the use of this translation.

This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
 **** shows the word which can not be translated.
 In the drawings, any words are not translated.

 LAIMS

Claim(s)]

Claim 1] Measurement programming equipment which it had in a means to create the new measurement program collectively measured from the measurement arrangement data of each measurement program containing each measurement path data of a means to generate each measurement arrangement data showing each order of measurement and arrangement of two or more device-under-test articles, and two or more aforementioned device-under-test articles, and each above.

Claim 2] Measurement programming equipment characterized by providing the following. A means to read each engineering-drawing side data including two or more each configuration information or size information on a device-under-test article. A means to create each drawing-for-inspection side data which added three-dimensions information the engineering-drawing side data of each above. A means to create each measurement program containing the measurement path data of two or more aforementioned device-under-test articles using the drawing-for-inspection side data of each above. A means to create the new measurement program collectively measured from the measurement arrangement data of a means to generate each measurement arrangement data showing the order of measurement of two or more aforementioned device-under-test articles, and arrangement using the drawing-for-inspection side data of the measurement program of each above, and each above, the measurement program of each above, and each above.

Claim 3] Measurement programming equipment which combines the measurement program of each above and is characterized by creating a new measurement program in a claim 2.

Claim 4] a claim 2 -- setting -- the above -- the measurement programming equipment characterized by performing operation of a new measurement program in the state of a measurement machine and off-line

translation done.]

NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
 ***** shows the word which can not be translated.
 In the drawings, any words are not translated.

 DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[001]

The technical field to which invention belongs] this invention relates to the measurement programming equipment which creates the measurement program for measuring the configuration of a device-under-test article.

[002]

[Description of the Prior Art] Conventionally, the following work is done in measurement of a machine part etc.
 Install a device-under-test article in a measurement on a plane.

An operator operates a measurement machine, teaches a measurement procedure, and creates a measurement program.

Perform real measurement according to the created measurement program.

[003] Moreover, recently, the simulation of measurement instruction is performed on a screen as deformation of 2 using the CAD drawing data of a device-under-test article, and the off-line teaching equipment of creating a measurement program is also realized. Moreover, in the inspection site, in order to inspect much device-under-test articles for a short time, installing, putting in block and measuring automatically two or more device-under-test articles a measurement on a plane is made. An example is raised to two or less.

Example 1 (in the case of a variant device-under-test article): While an operator actually measures, teach the measurement path of all device-under-test articles by the handicraft, create a measurement program, and pass and perform it to a measurement machine.

Example 2 (in the case of the same-type device-under-test article): When it arranges at a fixed interval to a measurement on a plane and an operator inputs the number of installation and installation interval of a device-under-test article at the time of measurement execution, the method of performing repeatedly only the number of a device-under-test article which installed the measurement program over the device-under-test article simple substance created / a manual operation or off-line teaching is performed.

[004]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] in recent years, we are anxious about the increase which is the time which in the inclination which the complicated device-under-test article of a configuration and a product increase, and type necking etc. takes in the manufacturing process of a product by demand of the consumer to progress of manufacture technology, such as a machine part, and a product Moreover, in an inspection site, coordinate measurement machines, such as a three dimensional measurer and a works microscope, are spreading.

[005] The equipment which creates efficiently the measurement program which measures automatically collectively two or more device-under-test articles installed in a measurement on a plane under such a background in order to do the inspection work of a device-under-test article for a short time efficiently for a short time was called for. However, the listing device of the conventional measurement program, when creating such a measurement program, a device-under-test article is installed in the arrangement same to a measurement on a plane as the time of measurement, and while an operator actually operates a measurement machine, there is only a method of performing measurement instruction. therefore, the trouble that neither the kind of device-under-test article, nor arrangement, the order of measurement, etc. can be flexibly changed to the measurement program which creation of a measurement setup or a measurement program took time, and was once created -- or there was a trouble of occupying a measurement machine the time of creation of a measurement program

[006] Moreover, with the off-line teaching equipment using the conventional CAD drawing data, only creation of a measurement program to the device-under-test article of a simple substance can be performed. Therefore, using the measurement program created with this equipment, as a means to measure two or more device-under-test articles collectively, when the device-under-test article of the same configuration was arranged at a fixed interval to a

measurement on a plane and an operator inputted device-under-test number of articles and an installation interval at the time of measurement, the method of repeating and performing a measurement program was taken. However, by this measuring method, since the configuration of a device-under-test article and arrangement which are measured collectively will be restricted, there was a trouble that the device-under-test article of a different configuration could not be measured at once.

007] this invention is made in view of the above-mentioned conventional trouble, and aims at offering the measurement programming equipment which can realize the increase in efficiency of inspection business.

008]

[Means for Solving the Problem] In order to solve the above-mentioned conventional technical problem, it sets to the measuring device of the measurement program of this invention. In invention of a claim 1 A means to generate each measurement arrangement data showing each order of measurement and arrangement of two or more device-under-test articles, It considered as the composition equipped with a means to generate the new measurement program collectively measured from the measurement arrangement data of each measurement program containing each measurement path data of two or more aforementioned device-under-test articles, and each above.

009] A means to read each engineering-drawing side data including two or more each configuration information or size information on a device-under-test article in invention of a claim 2, A means to create each drawing-for-inspection side data which added three-dimensions information to the engineering-drawing side data of each above, A means to create each measurement program containing the measurement path data of two or more aforementioned device-under-test articles using the drawing-for-inspection side data of each above, A means to generate each measurement arrangement data showing the order of measurement of two or more aforementioned device-under-test articles, and arrangement using the drawing-for-inspection side data of the measurement program of each above, and each above, It considered as the composition equipped with a means to generate the new measurement program collectively measured from the measurement arrangement data of the measurement program of each above, and each above.

010] By invention of a claim 3 The measurement program of each above was combined in the claim 2, and it considered as the composition characterized by creating a new measurement program. Invention of a claim 4 -- a claim -- setting -- the above -- it considered as the composition characterized by performing creation of a new measurement program in the state of a measurement machine and off-line

011]

[Embodiments of the Invention] Hereafter, this invention is explained, referring to a drawing. Drawing 1 is the block diagram showing the composition of one example of this invention, and is referred to at any time in the following explanation. The measurement programming equipment 3 of this invention is equipped with the drawing receive section 4, the drawing-for-inspection side editorial department 6, I/O control unit 7, an input unit 8, an output unit 9, the measurement information creation section 10, and the measurement information transducer 11.

012] The drawing receive section 4 receives the CAD drawing data 2 including the configuration of a device-under-test article created with this CAD equipment 1 from the CAD equipment 1 which designs a device-under-test article. Usually, the CAD drawing data 2 are created in the form of the standard format (IGES) of CAD, and are saved. Moreover, the drawing receive section 4 changes the received CAD drawing data 2 into the drawing-for-inspection side data 5. The drawing-for-inspection side data 5 consist of solidification information 22 grades which position the drawing displayed for the 2D or 2-dimensional configuration information which shows the configuration about the portions (a flat surface, a hole, height, etc.) which serve as the measuring object in a device-under-test article or this device-under-test article in three dimensions, as shown in drawing 2. The solidification information 22 is setting up a plan on XY flat surface, it setting up a side elevation on YZ flat surface, and displaying the aforementioned system of coordinates to each drawing supposing the three-dimensions system of coordinates of XYZ, and positions the drawing in three-dimensions space.

013] The drawing-for-inspection side editorial department 6 performs grant of drawing correction and solidification information 22 grade to the once changed drawing-for-inspection side data 5 as pretreatment of a measurement setup, and edits into the checking drawing-for-inspection side data 5 anew. It connects with the keyboard 16 which an operator operates, and the input unit 8 with which the input device of mouse 17 grade was formed, and I/O control unit can output the directions from an operator inputted into the input unit 8 to the drawing receive section 4, the drawing-for-inspection side editorial department 6, the measurement information creation section 10, and the measurement information transducer 11. An operator gives required directions, checking the display screen of an output unit 9. Moreover, I/O control unit 7 is displayed on the output unit 9 by which the information on the request of the drawing-for-inspection side data 5 (for example, drawing) was prepared in the display 18 and the plotter 19 grade via either the drawing receive section 4, the drawing-for-inspection side editorial department 6, the measurement information creation section 10 or the measurement information transducer 11.

[014] The measurement information creation section 10 receives instruction of the procedure about configuration measurement of the measuring object from an operator based on the changed drawing-for-inspection side data 5, and creates the measurement program 12 containing the measurement path data which show the procedure of measurement based on the contents of instruction. An operator transmits the contents of instruction of a measurement procedure through an input unit 8 and I/O control unit 7. The measurement program 12 consists of a parameter 32 which shows the items (a flat surface, a straight line, circle, etc.) set as the object of measurement, a parameter number 31 which shows the turn of measurement, and measurement path (measurement path) 33 grade to which a gauge head moves at the time of measurement, as shown in drawing 3. Here, the measurement path 33 is defined as sequence of points in the three-dimensions system of coordinates (standard coordinates) set up to drawing-for-inspection side data, and is changed into the sequence of points of the base coordinate system of a measurement machine at the time of measurement.

[015] measurement of the measuring object [the measurement information transducer 11 reads the measurement program 12 and the drawing-for-inspection side data 5 which were created, and] at the time of measurement (device-under-test article) -- the measurement arrangement data 13 including information, such as arrangement on board and turn of measurement, are generated. The measurement arrangement data 13 consist of conversion matrix 43 grades which change the coordinate value of the measurement path generated as a coordinate value of the measurement turn number 41 which shows the order of measurement of the device-under-test article to measure, the measurement program name 42, and the standard coordinates which each drawing-for-inspection side has independently into the coordinate value of a certain fixed standard coordinates, as shown in drawing 4. Moreover, in the measurement information transducer 11, the measurement procedure and measurement path of all the measurement programs 12 which were read are changed from the measurement arrangement data 13, and the new measurement program 12 is generated.

[016] The generated measurement program 12 is passed to the coordinate measurement machine 15 in the measurement machine interface 14. The coordinate measurement machine 15 measures a device-under-test article in response to this measurement program 12. Operation in this invention of the above composition is explained below. The CAD drawing data 2 inputted from CAD equipment 1 are changed in the drawing receive section 4, and the drawing-for-inspection side data 5 are created. Based on the created drawing-for-inspection side data 5, the measurement program 12 is created in the measurement information creation section 10. The created measurement program 12 is read into the measurement information transducer 11, arrangement of a device-under-test article, turn of measurement, etc. are set up, and the new measurement program 12 is created. Furthermore, in the measurement machine interface 14, the measurement program 12 is passed to the coordinate measurement machine 15, and actual measurement is performed.

[017] An example of the procedure which creates the measurement program 12 in the measurement information creation section 10 is explained using drawing 5. In Step s1, an operator sets up arbitrarily the system of coordinates used as the criteria of a measurement path on the drawing which displayed the drawing-for-inspection side data 5. Next, at Step s2, an operator directs the configuration element used as the measuring object on a drawing using a mouse. At the following step s3, an operator sets up the measurement conditions of the number of point of measurement, the measurement direction, etc. required for measurement. The measurement information creation section 10 is Step s4, and registers into the measurement program 12 the measurement path which generated the measurement path according to the aforementioned measurement conditions, is Step s5 and was generated. All the directions methods in this drawing 5 are performed by dialogic operation. By repeating processing of s5 from Step s1, the history information on the measurement data of the device-under-test article of a simple substance is generated on the measurement program 12. That is, measurement path data are generated by creating the operation history of a series of serially in the order which directed measurement. The generated measurement program 12 is saved at a storage. This measurement program 12 creates two or more measurement programs 12 from which it creates for every drawing-for-inspection side or kind of device-under-test article, and a measurement procedure differs to a certain device-under-test article.

[018] Next, in the measurement information transducer 11, an example of the procedure which creates the new measurement program 12 is explained using drawing 1, drawing 6, and drawing 7 using two or more measurement programs 12. In the measurement information transducer 11, an operator reads the arbitrary measurement programs 12 into the measurement information transducer 11 out of the measurement program 12 stored in the storage at the drawing 6 step r1. The measurement turn number the read measurement program 12 indicates a measurement program name and the order of measurement of a device-under-test article to be to the order display 71 of measurement of drawing 7 is displayed through an output unit 9. Moreover, at this time, the drawing-for-inspection side data 5 corresponding to the measurement program 12 are also read simultaneously, and are displayed on the device-under-test

article arrangement display 72. The device-under-test article arrangement display 72 displays either the whole company label flat surface of three-dimensions system of coordinates, i.e., XY and YZ, and the ZX sides, and changes with directions of an operator. Moreover, the device-under-test article arrangement display 72 has the standard coordinates 73 used as the criteria of all device-under-test article arrangement.

019] If the measurement program 12 is read into the measurement information transducer 11, a measurement turn number and a measurement program name are displayed on the order display 71 of measurement and the drawing-for-inspection side data 5 are displayed on the device-under-test article arrangement display 72. The measurement information transducer 11 from the position of the drawing-for-inspection side data 5 to the standard coordinates 73 of the device-under-test article arrangement display 72. The conversion matrix 43 (drawing 4) which changes the coordinate value of the standard coordinates of the drawing-for-inspection side data 5 into the coordinate value of the standard coordinates 73 of the device-under-test article arrangement display 72 is generated, and it stores in the measurement arrangement data 13 with the measurement turn number 41 and the measurement program name 42.

020] In this way, all the measurement program 12 respectively corresponding to the device-under-test article of a sample substance when it measures is read. The drawing 4 measurement turn number 41 displayed on the order display of the drawing 7 measurement expresses the order of measurement of the device-under-test article at the time of actually measuring. Moreover, when it reads, the drawing data displayed on the device-under-test article arrangement display 72 can also shift and display a position automatically so that it may not lap mutually. Moreover, the measurement path data of the selected measurement program 12 can also be arbitrarily edited by an operator's choosing the drawing-for-inspection side data 5 of the measurement program name of the order display 71 of measurement, or the part arrangement display 72 with a mouse 17, and calling the measurement information creation section 10.

021] Next, at the drawing 6 step r2, arrangement of the device-under-test article in the device-under-test article stallation field measurement on a plane at the time of measurement is set up to each drawing-for-inspection side data which the measurement information transducer 11 read. A setup of device-under-test article arrangement is performed by changing the display position of the drawing-for-inspection side data 5 displayed on the device-under-test article arrangement display 72. First, an operator directs the drawing-for-inspection side data 5 displayed on the device-under-test article arrangement display 72 with a mouse 17. Next, the position which an operator desires is made move or rotate the selected drawing-for-inspection side data 5. You may perform this operation by inputting movement magnitude and a rotation by the keyboard 16. Moreover, you may set up by inputting the distance of the standard coordinates of each measurement program 12 and the angle of rotation of an axis of coordinates to the standard coordinates 43 of the device-under-test article arrangement display 42 instead of movement magnitude and a rotation. Change of the display position of inspection data changes automatically the conversion matrix of the corresponding device-under-test article arrangement data 13 according to it. By performing this operation to all the drawing-for-inspection side data 5, the whole device-under-test article arrangement is determined, and the conversion matrix of the measurement arrangement data 13 is changed.

022] Next, at Step r3, the order of measurement of device-under-test articles is set up. A setup of the order of measurement is performed when an operator replaces the rank of the measurement program name displayed on the order display 41 of measurement. That is, by an operator's choosing arbitrary program names by the means of mouse 7 grade, and moving up and down out of the measurement program name currently displayed, the rank of a display is changed and the measurement turn number of the measurement arrangement data 13 is automatically changed according to the result.

023] However, a setup (Step r2) of device-under-test article arrangement and a setup (Step r3) of the order of measurement can be arbitrarily performed until it ends conversion of the measurement program 12. Finally, at Step r4, the new measurement program 12 is generated based on the measurement arrangement data created in this way. The measurement path of all the measurement programs 12 the measurement path data of the measurement program 12 newly generated were set up from all the measurement path data of the read measurement program 12 have according to the order of measurement of the measurement arrangement data 13 at this time, and read is changed into the coordinate value of the standard coordinates 73 of the device-under-test article arrangement display 72 have, and is stored in a measurement program 12 by the conversion matrix 43 of measurement arrangement data 13. Moreover, in use the measurement program 12 created by doing in this way creates the new measurement program 12, it can also be again read and used for the measurement information transducer 11.

024] According to the measurement programming equipment 3 of this example, in the coordinate measurement machine 15, since creation of the measurement program which measures two or more parts collectively can carry out off-line, it does not need to use the coordinate measurement machine 15 at the time of a measurement programming, and can raise the operating ratio of the coordinate measurement machine 15. Moreover, the once created measurement program is freely combinable, and it is lost that the kind of device-under-test article and arrangement are restricted

ce arrangement, turn to measure of the device-under-test article measured collectively can be set up and changed by
y operation, it becomes that it is possible in setting up arrangement which uses effectively a device-under-test
icle installation field measurement on a plane, and very effective measurement can realize.

025]

ffect of the Invention] According to this invention, the efficiency of measurement can be raised as mentioned above
m the ability of the device-under-test number of articles measured at once to be made [many]. Moreover, since the
ation work of this measurement program can be done off-line, it is not necessary to work by the measurement on a
ne, and the operating ratio of a measurement machine can be raised.

026] Furthermore, when there is a demand of change of the combination of the goods to measure, change of the turn
ich goods each measures, etc., correcting a measurement program can realize creation of eye a possible hatchet and
neasurement program, shortening of the time which correction takes, and improvement in the operating ratio of a
asurement machine. Moreover, it becomes possible to set up goods arrangement which uses the part installation
ld of a measurement machine effectively, and effective measurement support of the ability of the number of goods
asured at once to be made [many] can be realized.

ranslation done.]

NOTICES *

pan Patent Office is not responsible for any
mages caused by the use of this translation.

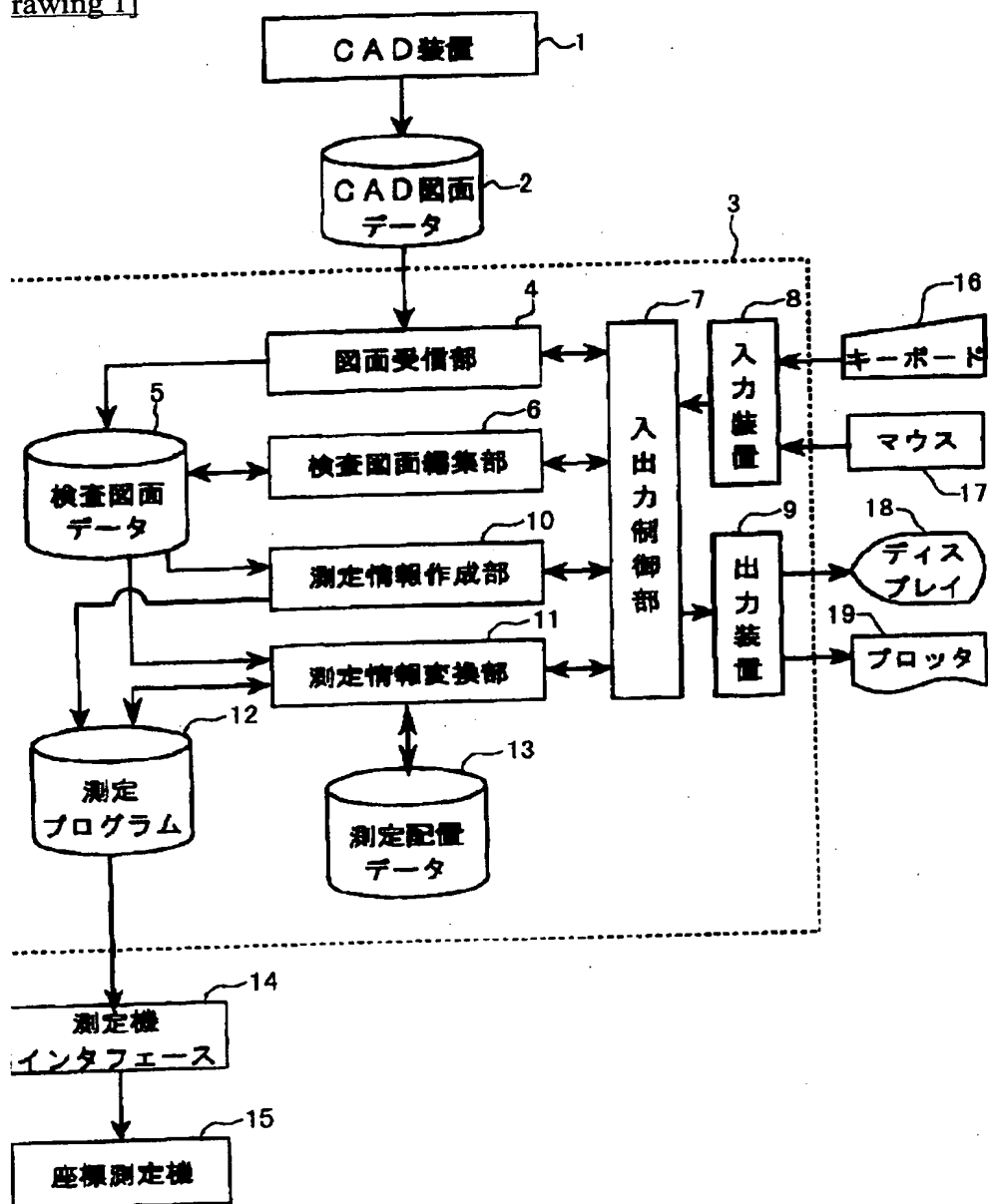
This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

*** shows the word which can not be translated.

n the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS

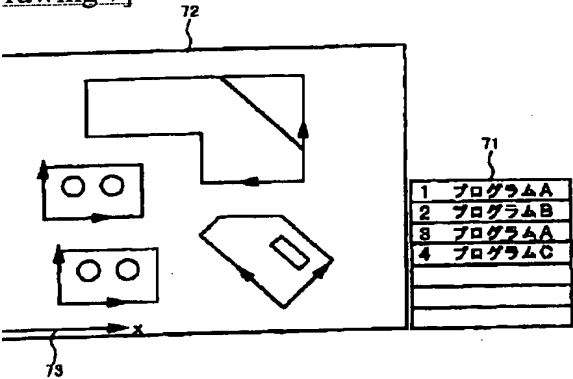
rawing 1]



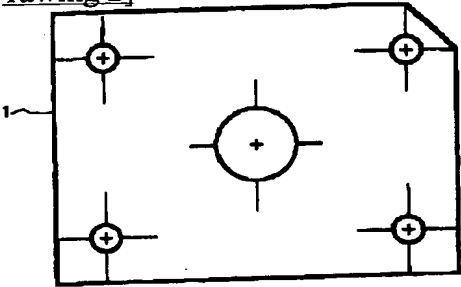
rawing 3]

31 定項目番号	32 測定項目	33 測定パス
1	平面	p1,p2,p3
2	直線	p1,p2
3	円	p1,p2,p3

Drawing 7]



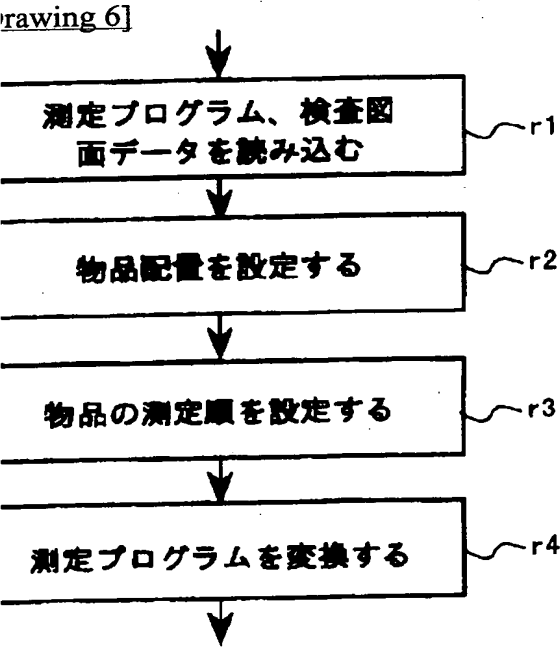
Drawing 2]



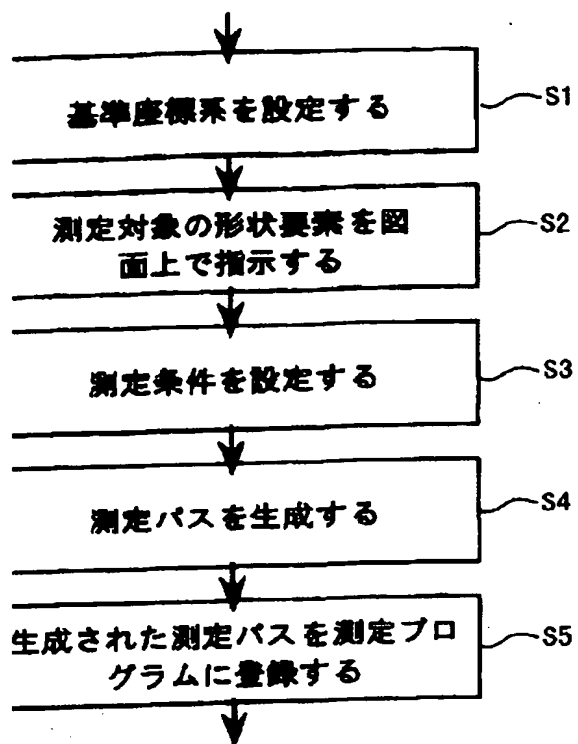
22 x

Drawing 4]

測定順序番号	測定プログラム名	変換マトリクス
1	プログラムA	$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$
2	プログラムB	$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$
3	プログラムA	$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$
4	プログラムC	$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$



Drawing 5]



[translation done.]